

DIN EN 60749-23

ICS 31.080.01

Ersatz für
DIN EN 60749-23:2004-10
Siehe Anwendungsbeginn

**Halbleiterbauelemente –
Mechanische und klimatische Prüfverfahren –
Teil 23: Lebensdauer bei hoher Temperatur (IEC 60749-23:2004 +
A1:2011);
Deutsche Fassung EN 60749-23:2004 + A1:2011**

Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –
Part 23: High temperature operating life (IEC 60749-23:2004 + A1:2011);
German version EN 60749-23:2004 + A1:2011

Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –
Partie 23: Durée de vie en fonctionnement à haute température (CEI 60749-23:2004 +
A1:2011);
Version allemande EN 60749-23:2004 + A1:2011

Gesamtumfang 11 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2004-04-01 angenommene Europäische Norm und die am 2011-03-03 angenommene Änderung A1 als DIN-Norm ist 2011-07-01.

Daneben darf DIN EN 60749-23:2004-10 noch bis 2014-03-03 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60749-23/A1:2009-09.

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 „Halbleiterbauelemente“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom IEC/TC 47 „Semiconductor devices“ erarbeitet.

Die Änderung A1 zu EN 60749-23:2004 ist in dieser Norm eingearbeitet und mit einem Randstrich gekennzeichnet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 60749-23:2004-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Im Abschnitt 7 wurden die bisher in Anmerkung 1 enthaltenen Empfehlungen über zusätzliche Beanspruchungs-Anforderungen für Teile, die nicht innerhalb von 96 h geprüft wurden, als Anforderung in den Normtext aufgenommen und in Tabelle 1 spezifiziert.
- b) Korrektur des Verweises unter 9 f).

Frühere Ausgaben

DIN EN 60749-23: 2004-10

**Halbleiterbauelemente –
Mechanische und klimatische Prüfverfahren –
Teil 23: Lebensdauer bei hoher Temperatur**
(IEC 60749-23:2004 + A1:2011)

Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –
Part 23: High temperature operating life
(IEC 60749-23:2004 + A1:2011)

Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –
Partie 23: Durée de vie en fonctionnement à
haute température
(CEI 60749-23:2004 + A1:2011)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2004-04-01 und die A1 am 2011-03-03 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

Vorwort

Der Text des Schriftstücks 47/1735/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe von IEC 60749-23, ausgearbeitet von dem IEC TC 47 „Semiconductor devices“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2004-04-01 als EN 60749-23 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2005-01-01
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2007-04-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60749-23:2004 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

Vorwort zu A1

Der Text des Schriftstücks 47/2017/CDV, zukünftige Änderung 1 zu IEC 60749-23:2004, ausgearbeitet von dem IEC TC 47 „Semiconductor devices“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2011-03-03 als Änderung A1 zu EN 60749-23:2004 angenommen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN und CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2011-12-03
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der Änderung entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2014-03-03

Anerkennungsnotiz

Der Text der Änderung 1:2011 zur Internationalen Norm IEC 60749-23:2004 wurde von CENELEC als Änderung zur Europäischen Norm ohne irgendeine Abänderung angenommen.